ДСТУ Б А.1.1-8-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

======================================================

МЕТОД РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО

АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ.

АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Терміни та визначення

ЗМІСТ

С.

1 Галузь використання................................. 1

2 Нормативні посилання ............................... 2

3 Основні положення .................................. 2

4 Загальні ноняття ................................... 3

4.1 Апаратура для рентгеноструктурного аналізу ..... 3

4.2 Основні параметри та характеристики апаратів

для рентгеноструктурного аналізу .............. 5

4.3 Складові частини та пристрої .................. 9

4.4 Основні методи рентгеноструктурного аналізу ... 12

Абетковий покажчик українських термінів ............. 19

Абетковий покажчик німецьких термінів ............... 21

Абетковий покажчик англійських термінів ............. 23

Абетковий покажчик французьких термінів ............. 25

Абетковий покажчик російських термінів .............. 27

ДСТУ Б А.1.1-8-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

================================================

МЕТОД РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО

АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛІВ.

АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Терміни та визначення

МЕТОД РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО

АНАЛИЗА МАТЕРИАЛОВ.

АПАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Термины и определения

METHOD OF X-RAY ANALYSIS MATERIALS.

INSTRUMENTATION EXECUTION

Terms and definitions

----------------------------------------------------------------

Чинний від 1994-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять

методу рентгеноструктурного аналізу.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'якові

для використання в усіх видах нормативної документації, у

довідковій та навчально-методичній літературі, а також для робіт

з стандартизації або при використанні результатів цих робіт,

включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри-

ємств, установ, організацій, що діють на території України, тех-

нічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженер-

них товариств, міністерств (відомств).

--------------------------------------------------------

Видання офіційне

- 2 -

ДСТУ Б А.1.1-18-94

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України.

| Порядок розроблення державних стандартів

-------------------------------------------------------------

ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України.

| Загальні вимоги до побудови, викладу,

| оформлення та змісту стандартів

--------------------------------------------------------------

КНД 50-011-93 | Основні положення та порядок розроблення

| стандартів на терміни та визначення

|

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Побудова, виклад та оформлення стандарту відповідають ви-

могам ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5, КНД 50-011.

3.2 Для кожного поняття встановлено один стандартизований

термін.

3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати

шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення

термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об-

сяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.4 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (dе),

англійські (еn), французькі (fr) і російські (rи) відповідники ста-

ндартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів

українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників

стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

- 3 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 АПАРАТУРА ДЛЯ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО

АНАЛІЗУ

4.1.1 рентгенівський дифрак- de R[o1]ntgendiffraktometer \*

тометр еn Х-rау diffraktometer

fr diffraktom[e2]tre [а4] \*

rayons Х

ru рентгеновский дифракто-

метр

Апарат, у якому для ре- Аппарат, в котором для ре-

єстрації, інтенсивності гистрации интенсивности

дифрагованих рентге- дифрагированных рентге-

нівських променів засто- новских лучей применяют-

совуються лічильники ся счетчики квантов с ре-

квантів з реєструваль- гистрирующими электрон-

ними електронними схе- ными схемами и записью

мами та записом резуль- результатов на диаграммной

татiв на дiаграмнiй стріч- ленте или цифропечатаю-

цi або цифродрукуваль- щем устройстве

ному пристрої

4.1.2 дифрактометр загаль- dе Allgemeinzweckdiffraktometer

ного призначення еn general purpose diffrakto-

meter

fr diffraktom[e2]tre d'usage \*

gen[e2]ral \*

ru дифрактометр общего на-

значения

Апарат для проведення Аппарат для проведения

широкого кола рентге- широкого круга рентгенос-

ноструктурних дослiд- труктурных исследований

жень матерiалів із засто- материалов с использовани-

суванням іонiзаційного ем ионизационного метода

методу реєстрації рентге- регистрации рентгеновских

нiвських променів лучей

4.1.3 текстурний рентгенів- de Texturr[o1]ntgendiffrakto- \*

ський дифрактометр meter

еn texture Х-гау diffraktometer

fr diffraktom[e2]tre de \*

texture [а4] rayons Х \*

ru текстурный рентгеновский

дифрактометр

Рентгенівський дифрак- Рентгеновский дифракто-

тометр, який застосо- метр, пpeдназначеный для

вується для дослідження исследования текстур

текстур

4.1.4 малокутовий рентгенів- de Kleinwinkelr[o1]ntgendif- \*

ський дифрактометр fraktometer

en small angle Х-rаy diffrakto-

meter

fr diffraktom[e2]tre [а4] \*

- 4 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

гауоns Х [а4] petits \*

angles

ru малоугловой рентгеновский

дифрактометр

Апаpат для вивчення ди- Аппаpат для изучения диф-

фузного та дискретного фузного и дискретного pас-

розсiювання рентгенів- сеивания рентгеновских лу-

ських пpоменiв субмікро- чей субмикроскопическими

скопічними (від 0,5 до (от 0,5 до 100 нм) неодно-

100 нм) неоднорідно- родностями в веществах, а

стями у речовинах, а та- также в материалах с боль-

кож у матеріалах з вели- шими (до 1000 А) периодами

кими (до 1000 А) пе- кристаллической решетки

рiодами кристлічної

гpатки

4.1.5 рентгенівський спек- de R[o1]ntgenspektrometer \*

трометр еn Х-raу spektrometer

fr spectrom[e2]tre [a4] \*

rayons Х

ru рентгеновский спектрометp

Спектрометр іонiзуючих Спектpометр ионизирую-

віпpомінювань для до- щих излучений для исследо-

слідження спектра вели- вания спектpа величин, ха-

чин, що характеризують рактеризующих поле рен-

поле рентгенівського ви- тгеновского излучения

пpомінювання

4.1.6 кристал - дифракцій- de Gamma-Kristallspektrometer

ний рентгенівський еn crystal diffraction Х-rау

спектрометр spectrometer

fr spectrom[e2]tre de diffrac- \*

tion [а4] cristal [a4] \*

rayons Х

ru кристалл - дифракционный

рентгеновский спектрометр

Рентгенівскький спектро- Рентгеновский спектpо-

метp, у якому для дослід- метр, в котором для иссле-

ження спектра викорис- дования спектра использу-

товується дифракція ви- ется дифракция излучения

промінювання на кри- на кристалланализаторе

сталаналізатоpі

4.1.7 рентгенівський aнaлi- de R[o1]ntgenanalysenkomplex \*

тичний комплекс en Х-rау analytical complex

fr complexe analytique

[a4] rayons Х \*

ru pентгеновский аналитичес-

кий комплекс

Комплекс апаратури для Комплекс аппаратуры для

автоматичного пpоведен- автомтического проведе-

ня рентгеноспектраль- ния рентгеноспектрально-

ного аналiзу, який скла- го анализа, состоящий из

дається з рентгенiвсько- рентгеновского спектромет-

го спектрометpа та ЕОМ pа и ЭВМ

- 5 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

4.2 ОСHОВHІ ПАРАМЕТРИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

AПAРATlВ ДЛЯ РЕНТГЕHОСТРУКТУРHОГО

АНАЛІЗУ

4.2.1 основна апаратурна de Ger[a1]tefehler \*

похибка en main instrumentaI еrrоr

fr erreur principale due аuх

іnstruments

ru основная аппаpатуpная

погрешность

Вiдносне сеpеднє квад- Относительное среднеквадpа-

ратичне вiдхилення ре- тическое отклонение ре-

зультатів випроміню- зультатов измерения плот-

вання щільності потоку ности pентгеновского

pентгенівського випpо- излучения

мінювання

4.2.2 Допустиме відхилення de Zul[a1]ssige Abweichung des \*

кута повоpоту блоку Drehwinkels des Gleichrich-

детектування tungsblockes

en turning angle admissible

deviation of the detection

block

fr d[e2]viation angulaire

admissible du bloc de d[e2]- \*

tection

ru допустимое отклонение угла

повоpота блока детектиpования

Відхилення дійсного зна- Отклонение действительно-

чення кута повоpоту бло- го значения угла поворота

ку від значення, задано- от значения,заданного ме-

го методикою контролю тодикой контpоля

4.2.3 діапазон кутових de Winkelverschiebungsbereich

перемiщень еn rаngе of angular displace-

ments

fr gammedesd[e2]placementsangu- \*

laires

ru диапазон угловых перемеще-

ний

Дiлянка кутових пере- Область угловых перемеще-

мiщень, для якої визна- ний, для которой определе-

чене донустиме відхи- но допустимое отклонение

лення

4.2.4 діапазон переміщення de R[o1]ntgenr[o1]hreverschiebun-\*

рентгенівської трубки gsbereich

еn displacement range of Х-ray

tube

fr gamme de d[e2]placement d'un \*

tube radiog[e2]ne \*

ru диапазон перемещения рен-

тгеновской трубки

- 6 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

Дiлянка кутових пepeмi- Область угловых перемеще-

щень рентгенiвської ний рентгеновской трубки,

тpубки, обмежена почат- огpаниченная начальными

ковим та кінцевим зна- и конечными значениями

ченням шкали шкалы

4.2.5 установочна швидкість de Beharrungsgeschwindigkeit

en regulation speed

fr vitesse dе r[e2]glage \*

ru установочная скорость

Встановена швидкість Установленная скорость

кутового переміщення углового перемещения бло-

блоку детектування ка детектирования

4.2.6 діапазон робочих кутів dе Pr[u1]fwinkelbereich des \*

гоніометричної при- metrischen Vorsatzger[a1]tes \*

ставки еn working angle гаnge оf а

metric adapter

fr gamme des angles dе travail

d'un adapteur m[e2]trique \*

ru диапазон рабочих углов го-

ниометрической приставки

Ділянки робочих кутів, у Область рабочих углов, в

якій реєструється pент- которой регистрируется

генівське випроміню- рентгеновское излучение

вання

4.2.7 похибка кутового de Winkelfehler

пристрою en angular bloc еrror

fr еrreur d'un bloc angulaire

ru погрешность углового ус-

тройства

Відхилення дiйсного ку- Отклонение действитель-

тового місцезнаходжен- ного углового положения

ня кристалотримача від кристаллодержателя от за-

заданого значення данного значения

4.2.8 похибка вимірювання de Drehwinkelmessfehler

кута повороту en measurement еrror of а

rotation angle

fr еrreur de mesurage d'un angle

de rotation

ru погрешность измерения

угла поворота

Biдхилення дійсного зна- Отклонение действительно-

чення кута повоpоту го значения угла повора

кристалотримача вiд за- кpисталлодеpжателя от за-

даного значення данного значения

4.2.9 кутова роздільність de Winkelaufl[o1]sung (Winke- \*

laufteilung)

en angular resolution

fr r[e2]soIution angulaire \*

ru угловое разрешение

- 7 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

Мінімальний кут ди- Минимальный угол дифрак-

фракції рентгенівського ции рентгеновского излуче-

випpомінювання, при ния, пpи котором оно раз-

якому воно відрiзняєть- личимо от фона

ся від фону

4.2.10 діапазон повороту de Pr[u1]fk[o1]rperdrehbereich \*

досліджуваного зразка en rotation range of а testing

sample

fr gamme de rotation d'un

[e2]chantillon [а4] \*

[e2]tudier \*

ru диапозон повоpота исследу-

емого образца

Ділянка зміни кута на- Область изменения угла

хилу в текстуpній пpи- наклона в текстурной при-

ставці ставке

4.2.11 робоча площа вхідного de Detektoreingangs[o1]ffnungsa- \*

вiкна детектора rbeitsfl[a1]che \*

en input window working аrеа of

the detector

fr surface utile de lа lucarne \*

d'entr[e2]e du d[e]tecteur \*

ru рабочая площадь входного

окна детектора

Площа, яка забезпечує Площадь, обеспечивающая

попадання квантів рент- попадание квантов рентге-

генівського випроміню- новского излучения внутрь

вання всередину робочо- рабочего обЬема детектора

го об'єму детектоpа

4.2.12 швидкiсть лiчення de Analysenleitungimpulsz[a1]- \*

імпульсів на аналітич- hlungsgeschwіndigkeit

нiй лiнiї en coating rate of impulses оn

analytical line

fr cadence de comptage des impul-

sions sur ligne analytique

ru скоpость счета импульсов на

аналитической линии

Швидкість лiчення iм- Скорость счета импульсов

пульсів на виході ре- на выходе регистpирующе-

єструвального пристрою, го устройсва, настpоенно-

який налагоджений на го на данную аналитичес-

дану аналітичну лінію кую линию

4.2.13 контрастність рентге- de R[o1]ntgendiffraktometerkon- \*

нiвського дифрактомет- trast

pа en contrast of а Х-rау diffrac-

tometer

fr contraste d'un diffracto-

m[e2]tre [a4] rayons X \*

ru контpастность pентгеновского

дифpактометpа

- 8 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

Відношення вихідного Отношение выходного сиг-

сигналу без фону на нала без фона на обpазце с

зpазку з відомим вмістом известным содеpжанием

елемента, що визначається, опpеделяемого элемента к

до вихідного сигналу, выходному сигналу на об-

який не містить елемента, pазце, не содеpжащем опpе-

що визначається деляемого элемента

4.2.14 межа виявлення de Nachweisbarkeitsgranze

en detection limit

fr limite dе d[e2]tection \*

ru предел обнаружения

Найменший вмiст eле- Наименшее содержание

мента, визначеного ро- определяемого расчетным

зрахунковим способом, способом элемента, кото-

який може бути виявле- рое может быть обнаруже-

ний за встановленою но по установленной мето-

методикою дике

4.2.15 кут відбору рентгенів- de Winkelstrahlungauswahlwinkel

ського випромінювання en angle of extraction of the

X-radiation

fr angle d'extraction дe lа

radiation Х

ru yгол отбора рентгеновского

излучения

Кут між площиною,до- Угол между плоскостью,

тичною до випроміню- касательной к излучающей

ючої поверхні, і напрям- поверхности, и направлени-

ком відбору рентгенів- ем отбора рентгеновского

ського випромінювання излучения

4.2.16 діапазон аналізуючих de Bereich der gepr[u1]tten \*

хімічних елементів chemishen Elemente

en range of the analysed chemical

elements

fr gamme des [e2]lements chimi- \*

gues [a4] analyser \*

ru диапазон анализирующих

химических элементов

Ділпянка хiмчних еле- Область химических эле-

ментів із гранично мали- ментов с предельно малым

ми та гранично велики- и предельно большим атом-

ми атомними номерами, ными номерами, в которой

в якій вони можуть бути они могут быть определены

визначені

4.2.17 спектральна розділь- de Spektralaufteilung

нiсть en spectral resolution

fr r[e2]solution spectrale

ru спектральное расширение

Найменша відстань між Наименьшее расстояние

двома сумiжними мак- между двумя соседними мак-

симумами, якi спосте- симумами, наблюдаемыми

рігаються над фоном над фоном

- 9 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

4.2.18 мiнімальний крок de Mindestabtastungsschritt

сканування en minimum step of scanning

fr pas minimal de balayage

ru минимальный шаг скани-

рования

Найменший кут поворо- Наименьший угол поворота

ту або найменше лiнійне или наименьшее линейное

перемiщення елементів перемещение элементов

спектрометричного при- спектрометрирующего уст-

строю ройства

4.2.19 вибір випромінювання de Strahlungsauswahl

en radiation sampling

fr choix de radiation

ru выбор излучения

Вибір випромінювання Выбор излучения рентге-

рентгенівської трубки, новской трубки, при кото-

при якому відстань між ром расстояние между дву-

двома відбиттями, що мя регисгрируемыми отра-

реєструються, тим бiль- жениями тем больше, чем

ша, чим більша довжина больше длина волны излу-

хвилі випромінювання чения

4.3 СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА ПPИCTPOЇ

4.3.1 peнтгенівський спек- de R[o1]ntgenspektrometerkanal \*

трометричний канал en spectrometric Х-rау channel

fr сanal spectrom[e2]trique \*

[а4] rayons Х

ru рентгеновский спектромет-

рический канал

Частина пристрою, яка Часть устройства, обеспечи-

забезпечує вiдокрем- вающая выделение и регис-

лення i реєстрацію виб- трацию выбранного участ-

раної ділянки спектра ка спектра

4.3.2 фіксований pентгенів- de Fixierr[o1]ntgenspektrometer- \*

ський спектрометрич- kanal

ний канал en fixed spectrometric Х-rау

channel

fr canal spectrom[e2]trique, \*

fixe rауоns Х

ru фиксированный рентгенов-

ский спектрометрический

канал

Канал для відокремлен- Kанал для выделения и ре-

ня і pеєстрації заздале- гистрации заранее выбран-

гідь вибраної дiлянки ного участка рентгеновско-

рентгенівського спектра го спектра

4.3.3 сканувальний рентге- de Ahtastungsr[o1]ntgenspektro- \*

нівський спектромет- meterkanal

ричний канал en scanning spectrometric X-ray

channel

- 10 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

fr canal de Ьalaуаge spectro-

m[e2]trique [а4] rауons Х \*

ru сканирующий рентгеновс-

кий спектрометрический

канал

Канал з автоматичною Kанал с автоматической

передбудовою ділянок перестройкой участков

спектра і з можливістю спектра и с возможностью

його запису его записи

4.3.4 рентгенівська гоніо- de R[o1]ntgengoniometervorsatz- \*

метрична приставка ger[a1]t \*

en Х-rау goniometry adaptor

fr adapteur goniom[e2]trigue \*

[a4] rayons X \*

ru рентгеновская гониометри-

ческая приставка

Приставка, яка забезпе- Приставка, обеспечиваю-

чує усереднення кри- щая усреднение кристаллов

сталів обертанням зраз- вращением образца в со-

ка у власнiй площині бственной плоскости

4.3.5 рентгенівська камера de R[o1]ntgenkamera \*

en Х-ray camera

fr chambre de diffraction

ru рентгеновская камера

Прилад для реєстрації на Прибор для регистрации на

рентгенівську плівку диф- рентгеновскую пленку диф-

рагованого рентгенів- рагированного рентгенов-

ського випромінювання ского излучения

4.3.6 детектор рентгенівсько- de R[o1]ntgenstrahlungsdetektor \*

го випромінювання en Х-rау radiation detector

fr d[e2]tecteur de radiation Х

ru детектор рентгеновского

излучения

Пepeтворювач квантів Преобразователь квантов

рентгенівського випро- рентгеновского излучения в

мiнювання в імпупьси импульс напряжения или

напруги або струму тока

4.3.7 детектор телевізійного de Fernsehdetektor

типу еn television type detector

fr d[e2]tecteur de type-tele- \*

vision

ru детектор телевизионного

типа

Прилад для одержання Прибор для получения дву-

двомiрної дифракцiйної мерной дифракционной

картини на телеекрані картины на телеэкране

4.3.8 кристал-аналізатор de Kristallanalysator

en crystal-analyser

- 11 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

fr cristal analyseur

ru кристалл-анализатор

Крістал - дифракційний Kpисталл-дифракционный

диспергувальний eлe- диспергирующий элемент

мент для розкладання в для разложения в спектр

спектр рентгенiвського рентгеновского излучения и

випромiнювання і відо- выделения заданного спек-

кремлення заданого трального интервала

спектрального iнтервалу

4.3.9 кристал-монохроматор de Kristallmonochromator

еn crystal-monochromator

fr cristal-monochromateur

ru кристалл-монохроматор

Елемент для монохрома- Элемент для монохромати-

тизації рентгенівського зации рентгеновского излу-

випромінювання чения

4.3.10 рентгевівський фільтр de R[o1]ntgenfilter \*

еn Х-raу filter

fr filtre [а4] rayons Х \*

ru peнтгеновский фильтр

Фільтр iз поглинального Фильтр из поглощающего

матеріалу, призначений материала, пpедназначен-

для послаблення або ный для ослабления или

зміни спектрального изменения спектрального

складу випромінювання состава излучения

4.3.11 джерело peнтгенів- de R[o1]ntgenstrahlungsquelle \*

ського випромінювання en source оf Х-rау radiation

fr soyrce de rayonnement

ru источник рентгеновского

излучения

Сукупність пристроїв, які Совокупность устройств,

забезпечують одержання обеспечивающих получение

рентгенiвського вип- рентгеновского излучения с

ромінювання з задани- заданными параметрами

ми параметрами

4.3.12 комплекс керуючий de Difraktоmеtеrstеuerranlage

дифрактометричний en diffractometric control

complex-KYD

fr complexe dе commande diffrac-

tom[e2]trigue \*

ru комплекс управляющий ди-

фрактометрический

Комплекс для програм- Комплекс для программно-

ного керування, збору, го управления, cборa, обра-

обробки і реєстрації ботки и регистрации инфор-

інформації мации

- 12 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

4.4 OCHOBНI МЕТОДИ

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛІ3У

4.4.1 якісний pентгенівський de Qualitative R[o1]ntgenphase- \*

фазовий аналіз nanalyse

en qualitative Х-raу phase

analysis

fr analyse de phases qualitative

[а4] rауоns X \*

ru качественный рентгеновс-

кий фазовый анализ

Визначення природи Определение природы крис-

кристалічних фаз міне- таллических фаз минералов

ралів зразка за характер- образца по характерным для

ним для кожної фази каждой фазы набором ли-

набором ліній або піків - ний или пиков - набором

набором міжплощинних межплоскостных расстоя-

відстаней та iнтенсив- ний и интенсивностей

ностей

4.4.2 кількісний рентгенів- de Qualitative R[o1]ntgenphasen- \*

ський фазовий аналіз analyse

en qualitative Х-rау phase

analysis

fr analyse de phase quantative

[a4] rауоns X

ru количесгвенный ренгенов-

ский фазовый анализ

Визначення залежності Определение зависимости

інтенсивностi дифрак- интенсивности дифракцион-

ційного відбиття від кіль- ного отражения от коли-

кocтi відповідної фази чества соответствующей

обчислення її процен- фазы и вычисление ее про-

тного вмісту з урахуван- центного содержания с уче-

ням масового коефі- том массового коэффици-

цiєнта вбирання речовин ента поглощения вещества

i кожної фази и каждой фазы

4.4.3 метод рентгенострук- de R[o1]ntgenstrukturanalyse \*

турного аналізу en m[e2]thod of Х-rау \*

(diffraction) analysis

fr methode d'analyse (structu-

rale) aux rayons Х

ru метод рентгеноструктурно-

го анализа

Визначення кристалiч- Определение кристалличес-

ної структури досліджу- кой структуры исследуемо-

ваної речовини, проце- го вещества, процессов, свя-

сів, які пов'язані з занных с перестройкой ато-

перебудовою атомів у мов в кристаллической ре-

кристалiчній гратці, за шетке, по дифракционной

дифракційною картиною, картине, возникающей при

що виникає при розсіюван- рассеивании pентгеновских

ні рентгенівських проме- лучей кристаллической ре-

нів кристалічною граткою шеткой

- 13 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

4.4.4 метод рентгеноспек- de R[o1]ntgenspektralanalyse \*

трального аналізу en method of analysis by Х-ray

spectrometry

fr m[e2]thode d'analyse radio- \*

spectrale

ru метод рентгеноспектраль-

ного анализа

Визначення хiмiчного Определение химического

складу речовини за селек- состава веществ по селек-

цією та реєстрацією рен- ции и регистрации pентге-

тгенівського характерис- новского характеристичес-

тичного спектра, який кого спектра, испускаемого

випромінюється атома- атомами при облучении их

ми при опромінюванні рентгеновскими лучами

їх рентгенівськими про-

менями

4.4.5 метод додавання фази, de Bestimmungsphasenzusatzver-

що визначається fahren

en method of addition of а

defined phase

fr m[e2]thode d'addition d'une \*

phase [a4] d[e2]finir \*

ru метод добавления опреде-

ляемой фазы

Визначення кiлькiсного Определение количествен-

складу шляхом вимірю- ного состава путем измере-

вання відношення інтен- ния отношений интенсив-

сивносей дифраційних ностей дифракционных ли-

ліній шуканої фази та ний искомой фазы и извест-

відомої ной

4.4.6 метод відношення de Methode des Verh[a1]ltnisses \*

iнтенсивностей аналі- der Intensit[a1]t der

тичних ліній Analysenlinien

еn intensity relation method of

аnalytical lines

fr m[e2]thode des relations

d'intersite des lignes

analytiques

ru метод отношений интенсив-

ности аналитических линий

Визначення приблизно- Определение приблизитель-

го вмісту кpисталічних ного содержания кристал-

фаз шляхом вимірюван- лических фаз путем измере-

ня відношення iнтенсив- ния отношения интенсив-

ностей аналітичних ліній ностей аналитических ли-

зразка, який складається ний образца, состоящего

тільки з кристалічних фаз только из кристаллических фаз

4.4.7 метод прямого вимірю- de Methode der Direktmessung des

вання коефіцієнта Absortionskoeffizientes

вбирання en direct method of measurement

of the absortion factor

fr m[e2]thode dе mesurage direct \*

- 14 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

du соefficient d'absorption

ru метод прямого измерения

коэффициента поглощения

Визначення відношення Определение отношения

коефіцієнтів вбирання коэффициента поглощения

досліджуваного зразка i исследуемого образца и чис-

чистої фази, що визнача- той определяемой фазы

ється

4.4.8 метод внутрішнього de Innenstandardverfahren

стандарту en method of an interior

standard

fr m[e2]thode d'un standard \*

int[e2]rieur \*

ru метод внутреннего стандар-

та

Встановлення співвід- Установление соотношения

ношення фази, що виз- определяемой фазы и вве-

начається, та введеної денной стандартной фазы

стандартної фази за по разности интенсивнос-

рiзницею інтенсивностей тей их дифракционных от-

дифракцiйних відбитків ражений

4.4.9 визначення напружень de Beanspruchungsbestimmung

еn voltage definition

fr d[e2]finition de tensions \*

ru определение напряжений

Метод побудований на Метод основан на прецези-

прецезійному визначенні онном определении пара-

параметрів гратки метров решетки

4.4.10 метод дослідження de Method der Untersuchung der

поверхні і тонких Oberfl[a1]che und D[u1]nn- \*

плівок filme

en testing method of the surface

and the fine films

fr m[e2]thod d'ectude de la \*

surface et des films fins

ru метод исследования повер-

хности и тонких пленок

Метод, який дозволяє Метод, позволяющий изме-

зміною кута падіння пер- нением угла падения пер-

винного пучка змінюва- вичного пучка изменять глу-

ти глибину проникнен- бину проникновения рен-

ня рентгенівських про- тгеновских лучей в образец

менів у зразок

4.4.11 метод дослідження при de Method der Untersuchung bei

різних температурах Differenztemperaturen

en testing method at different

temperatures

fr m[e2]thod d'etude aux tempe- \*

ratures diff[e2]rentes \*

ru метод исследования при раз-

- 15 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

личных температурах

Спосiб вивчення кінети- Способ изучения кинетики

ки високо- i низькотем- высоко- и низкотемператур-

пературних реакцій в спе- ных реакций в специальных

ціальних високо- i низь- высоко- и низкотемператур-

котемпературних каме- ных камерах с последую-

рах з подальшою peєcтра- щей регистрацией отражен-

цiєю вiдбитків рент- ных рентгеновских лучей

генівських променів при при заданных температу-

заданих температурних рах

параметрах

4.4.12 метод дослідження при de Methode der Untersuchung bei

різних тисках Differenzdrucken

en testing method at different

рrеssions

fr m[e2]thode d'etude аих \*

pressions diff[e2]r[e2]ntes \*

ru метод исследования при pаз-

личных давлениях

Дослідження полімор- Исследование полиморф-

фних пepeтворень, виз- ных превращений, опреде-

начення стисливості ре- ление сжимаемости вещес-

човини, дослідження ре- тва, исследование реакций,

акцiй, які проходять у проходящих в гидротер-

гідротермальних умовах мальных условиях

4.4.13 метод Лауе de laue-Method

en Lower's method

fr m[e2]thode de Lower

ru метод Лауэ

Зйомка нерухомого мо- Съемка неподвижного мо-

нокристала у паралель- нокристалла в параллель-

ному поліхроматичному ном полихроматическом

променi луче

4.4.14 метод обертання i de Methode der Kristalldrehung

коливання кристала und Schwingung

en method of crystal rotation

and vibration

fr m[e2]thode de rotation et de \*

vibration du crystal

ru метод вращения и колеба-

ния кристалла

Зйомка кристала при Cъемка кристалла при ко-

коливаннi навколо осі, лебании вокруг оси, перпен-

перпендикулярної до дикулярной к первичному

первинного монохрома- монохроматическому пуч-

тичного пучка ку

4.4.15 виэначення товщиии de Stoffdiskenbestimmung

матеріалу en definition of thickness

material

fr d[e2]finition del'[e2]pai- \*

- 16 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

sseur d'un materiau

ru определение толщины ма-

териала

Визначення інтенсив- Измерение интенсивности

ності випромінювання, излучения, прошедшего че-

яке пройшло крізь до- рез исследуемый материал

сліджуваний матеріал

4.4.16 локальний фазовий de Lokale Phasenanalyse

аналіз en local phase analysis

fr analyse de phase locale

ru локальный фазовый анализ

Дослідження фазового Исследование фазового со-

складу в малих ділянках става в малых областях при

при використанні пер- использовании первичного

винного пучка малого пучкa малого сечения диа-

nepepiзy дiаметром 100 метром 100 мкм

мкм

4.4.17 метод порошку de Pulververfahren

en powder method

fr m[e2]thode de poudre

ru метод порошка

Вимірювання відбиття Измерение отражений мо-

монохроматичних рент- нохроматических рентге-

генівських променів від новских лучей от образца с

зразка з розмірами кри- размерами кристаллов от 5

сталів від 5 до 40 мкм до 40 мкм

4.4.18 метод дослідження при de Kleinwinkeluntersuchungsver-

малих кутах fahren

en test method with small angles

fr m[e2]thode d'[e2]tude avec \*

petits angles

ru метод исследования при

малых углах

Фазовий аналіз речови- Фазовый анализ вещества

ни при кутових поворо- при угловых поворотах об-

тах зразка і детектора в разца и детектора в пределах

межах від декількох хви- от нескольких минут до гра-

лин до градусів дусов

4.4.19 стандартна речовина de Standardstoff

en standard matter

fr mat[e2]re standard \*

ru стандартное вещество

Речовина, яка відтворює Вещество, дающее рентге-

рентгенограму, що неза- нограмму, не зависящую от

лежна від умов і ступеня условий и степени помола и

помолу та не схильна до не склонное к стеклообра-

склоутворення зованию

4.4.20 деформація кристалу de Kristallitdeformation

- 17 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

en crystallite defomation

fr d[e2]formation de lа \*

cristallite

ru деформация кристаллита

Зміна параметрів еле- Изменение параметров эле-

ментарної комiрки під ментарной ячейки под дей-

дiєю мiкронапружень ствием микронапряжений

4.4.21 параметр комірки de Kammerparameter

en cellular parameter

fr param[e2]tre d'un cellule \*

ru параметр ячейки

Міжплощинні відстані Межплоскостные расстоя-

для ряду ліній з відо- ния для ряда линий с извест-

мими індексами відбиття ными индексами отражений

4.4.22 максимум дифракцій- de Diffraktionspitzenmaximum

ного піка en maximum diffraction peak

fr valeur maxіmale du point

de diffraction

ru максимум дифракционного

цикла

Вимірювання інтенсив- Измерение интенсивности

ності дифракцiйного цикла дифракционного пика в точ-

в точках, розділених про- ках, разделенных промежут-

міжком 2-5, визначення ком 2-5, определение цент-

центру тяжіння ра тяжести

4.4.23 еталонна речовина de Standardsubstanz

en reference substance

fr substance [e2]talon \*

ru эталонное вещество

Речовина, для якої точно Вещество, для которого точ-

відома величина парамет- но известна величина элемента-

рів елементарної комірки рной ячейки

4.4.24 коефіцієнт послаблення de Schw[a1]chungsfactor \*

en weakening factor

fr facteur d'affaiblissement

ru коэффициент ослабления

Зменшення інтенсив- Ослабление интенсивности

ності рентгенівського рентгеновского пучка при

пучка при проходженні прохождении его через слой

його крізь шар речовини вещества

4.4.25 розмиття дефракційного de Diffraktionsspitzentr[u1]bung \*

піка en smearing of a diffraction peak

fr an[e2]antissement d'une pointe \*

de diffraction

ru размытие дифракционного пика

Сукупність факторів Совокупность факторов

(дисперсність зразка, (дисперсность образца, не-

- 18 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

несувора монохроматич- строгая монохроматичность из-

ність випромінювання, лучения, наличие

наявність мікронапру- микронапряжений и т.д.),

жень та ін.), які зумов- вызывающих нечеткую кон-

люють нечітку конфігу- фигурацию пиков

рацію піків

4.4.26 дифузне розсіювання de Kleinwinkelzerstreuung

під малими кутами en diffuse seattering under

small sized angles

fr dispersion diffuse [a4] \*

petits angles

ru диффузное рассеивание под

малыми углами

Дифузне розсіювання, Диффузное рассеивание,

яке обумовлене неодно- обусловленное неоднород-

рідністю електронної ностью электронной плот-

густини на відстанях ности на расстояниях того

того самого порядку, же порядка, кристаллов,

кристалів, які склада- построенных из крупных

ються з великих молекул, молекул, в которых перио-

в яких періоди ідентично- ды идентичности на два по-

сті на два порядки пере- рядка превышают длину

вищують довжину хвилі волны излучения

випромінювання

4.4.27 інтенсивність розсію- de Objektzerstreungsintensit[a1]t\*

вання об'єктом en diffusion intensity with an

object

fr іntensit[e2] de diffusion avec\*

un objet

ru интенсивность рассеивания

объектом

Добуток числа частинок Произведение числа частиц

об'єкта, які беруть учас- об'екта, участвующих в рас-

ть у розсіюванні, на сеивании, на интенсивность

інтенсивність розсіюванн- рассеивания одной частицы

ня oднієї частинки

4.4.28 аналітична лiнiя de Analysenlinie

en аnаlytical line

fr linge analytique

ru аналитическая линия

Лiнiя мінералу, вiльна Линия минерала, свободная

від накладання і з ві- от наложений и с извест-

домим значенням вели- ным значением величины

чини міжплощинної від- межплоскостного расстоя-

стані ния

- 19 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

аналіз рентгенівський фазовий кількісний ................. 4.4.2

аналіз рентгенівський фазовий якісний .................... 4.4.1

аналіз фазовий локальний ................................. 4.4.16

вибір випромінювання ..................................... 4.2.19

визначення напружень ..................................... 4.4.9

визначення товщини матеріалу ............................. 4.4.15

відхилення кута повороту блоку дефектування допустиме ... 4.2.2

детектор рентгенівського випромінювання .................. 4.3.6

детектор телевізійного типу .............................. 4.3.7

деформація кристалу ...................................... 4.4.20

джерело рентгенівського випромінювання ................... 4.3.11

дифрактометр загального призначення ...................... 4.1.2

дифрактометр рентгенівський .............................. 4.1.1

дифрактометр рентгенівськнй малокутовий .................. 4.1.4

дифрактометр рентгенівський текстурний ................... 4.1.3

діапазон аналізуючих хімічних елементів .................. 4.2.16

діапазон кутових переміщень .............................. 4.2.3

діапазон переміщення рентгенівської трубки ............... 4.2.4

діапазон повороту досліджуваного зразка .................. 4.2.10

діапазон робочих кутів гоніометричної приставки .......... 4.2.6

інтенсивність розсіювання об'єктом ....................... 4.4.27

камера рентгенівська ..................................... 4.3.5

канал рентгенівський спектрометричний .................... 4.3.1

канал рентгенівський спектрометричний сканувальний ....... 4.3.3

канал рентгенівський спектрометричний фіксований ......... 4.3.2

коефіцієнт послаблення ................................... 4.4.24

комплекс керуючий дифрактрометричний ..................... 4.3.12

комплекс рентгенівський аналітичний ...................... 4.1.7

контрастність рентгенівського дифрактометра .............. 4.2.13

кристал-аналізотор ....................................... 4.3.8

кристал-монохроматор...................................... 4.3.9

крок склнування мінімальний............................... 4.2.18

кут відбору рентгенівського випромінювання ............... 4.2.15

лінія аналітична ......................................... 4.4.28

максимум дифракційного піка .............................. 4.4.22

межа виявлення ........................................... 4.2.14

метод відношення інтенсивностей аналітичних ліній ........ 4.4.6

метод внутрішнього стандарту ............................. 4.4.8

метод додавання фази, що визначається .................... 4.4.5

метод дослiдження поверхні і тонких плівок ............... 4.4.10

метод дослідження при малих кутах ........................ 4.4.18

метод дослідження при різних температурах ................ 4.4.11

метод дослідження при різних тисках ...................... 4.4.12

метод Лауе ................,.............................. 4.4.13

метод обертання і коливання кристала ..................... 4.4.14

метод порошку ............................................ 4.4.17

метод прямого вимірювання коефіцієнта вбирання ........... 4.4.7

метод рентгеноспектрального аналізу ...................... 4.4.4

метод рентгеноструктурного аналізу ....................... 4.4.3

параметр комірки ......................................... 4.4.21

площа вхідного вікна детектора робоча .................... 4.2.11

похибка апаратурна основна ............................... 4.2.1

похибка вимірювання кута повороту ........................ 4.2.8

похибка кутового пристрою ................................ 4.2.7

- 20 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

приставка рентгенівська гоніометрична .................... 4.3.4

речовина еталонна ........................................ 4.4.23

речовина стандартна ...................................... 4.4.19

роздільність кутова ...................................... 4.2.9

роздільність спектральна ................................. 4.2.17

розмиття дифракційного піка .............................. 4.4.25

розсіювання під малими кутами дифузне .................... 4.4.26

спектрометр рентгенівський ............................... 4.1.5

спектрометр рентгенiвський кристал-дифракційний .......... 4.1.6

фільтр рентгенівський .................................... 4.3.10

швидкість установочна .................................... 4.2.5

швидкість лічення імпульсів на аналітичній лінії ......... 4.2.12

- 21 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК HIMEЦbKИX TEPMIHIB

Abtastungsr[o1]ntgenspektrometerkanal .................. 4.3.3 \*

Allgemeinzweckdiffraktometer............................ 4.1.2

Analysenleitungimpulsz[a1]hlungsgeschwindigkeit ........ 4.2.12 \*

Analysenlinie .......................................... 4.4.28

Beanspruchungsbestimmung ............................... 4.4.9

Beharrungsgeschwindigkeit .............................. 4.2.5

Bereich der gepr[u1]ften chemischen Elemente............ 4.2.16 \*

Bestimmungsphasenzusatzverfahren ....................... 4.4.5

Detektoreingangs[o1]fnungsarbeitsfl[a1]che ............. 4.2.11 \*

Diffraktometersteueranlage ............................. 4.3.12

Diffraktionspitzenmaximum .............................. 4.4.22

Diffraktionspitzentr[u1]bung ........................... 4.4.25 \*

Drehwinkelmessfehler ................................... 4.2.8

Fernsehdetektor......................................... 4.3.7

Fixierr[o1]htgenspektrometerkanal ...................... 4.3.2 \*

Gamma-Kristallspektrometer ............................. 4.1.6

Geratefehler ........................................... 4.2.1

Innenstandardverfahren ................................. 4.4.8

Kammerparameter ........................................ 4.4.21

Kleinwinkelr[o1]ntgendiffraktometer .................... 4.1.4 \*

Kleinwinkeluntersuchungsverfahren ...................... 4.4.18

Kleinwinkelzerstreuung ................................. 4.4.26

Kristallanalysator ..................................... 4.3.8

Kristallitdeformation .................................. 4.4.20

Kristallmonochromator .................................. 4.3.9

Laue Method ............................................ 4.4.13

Lokale Phasenanalyse ................................... 4.4.16

Methode der Direktmessund des Absorptionskoeffizientes . 4.4.7

Methode der Kristalldrehung und Schwingung ............. 4.4.14

Methode der Untersuchung bei Differenzdrucken .......... 4.4.12

Methode der Untersuchung bei Differenztemperatur ....... 4.4.11

Methode der Untersuchung der Oberfl[a1]che und

D[u1]nnfilme ........................................... 4.4.10 \*

Methode der Verh[a1]ltnisses der Intensit[a1]t der \*

Analysenlinien ......................................... 4.4.6

Mindestastungssehritt .................................. 4.2.18

Nachweisbarkeitsgrenze ................................. 4.2.14

Objektzerstreungsintensit[a1]t ......................... 4.4.27 \*

Pr[u1]fk[o1]rperdrehbereich ............................ 4.2.10 \*

Pr[u1]winkelberiech des metrischen Vorsatzger[a1]tes ... 4.2.6 \*

Pulververfahren ........................................ 4.4.17

Qualitative R[o1]ntgenphasenanalyse .................... 4.4.1 \*

Quantitative R[o1]ntgenphasenanalyse ................... 4.4.2 \*

R[o1]ntgenanalysentkomplex ............................. 4.1.7 \*

R[o1]ntgendiffraktometer ............................... 4.1.1 \*

R[o1]ntgendiffraktometerkontrast ....................... 4.2.13 \*

R[o1]ntgenfilter ....................................... 4.3.10 \*

R[o1]ntgengoniometervorsatzger[a1]t .................... 4.3.4 \*

R[o1]ntgenkamera ....................................... 4.3.5 \*

R[o1]ntgenrohreverschiebungsbereich .................... 4.2.4 \*

R[o1]ntgenspektralanalyse .............................. 4.4.4 \*

R[o1]ntgenspektrometer ................................. 4.1.5 \*

R[o1]ntgenspektrometerkanal ............................ 4.3.1 \*

R[o1]ntgenstrahlungsdetektor............................ 4.3.6 \*

R[o1]ntgenstrahlungsquelle ............................. 4.3.11 \*

- 22 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

R[o1]ntgenstrukturanalyse .............................. 4.4.3 \*

Schw[a1]chungsfaktor ................................... 4.4.24 \*

Spektralaufteilung ..................................... 4.2.17

Standardstoff .......................................... 4.4.19

Standardsubstanz ....................................... 4.4.23

Stoffdiskenbestimmung .................................. 4.4.15

Strahlungsauswahl....................................... 4.2.19

Textur[o1]ntgendiffraktometer........................... 4.1.3 \*

Winkelanfl[o1]sung (Winkelaufteilung) .................. 4.2.9

Winkelfehler............................................ 4.2.7

Winkelstrahlungauswahlwinkel ........................... 4.2.15

Winkelverschiebungsbereich ............................. 4.2.3

Zulassige Abweichung des Drehiwinkels des

Gleichrichtungsblockes ..................................4.2.2

- 23 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

AБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

analutical line ......................................... 4.4.28

angular bloc error ...................................... 4.2.7

angular resolution ...................................... 4.2.9

angular of extraction of the X-radiation ................ 4.2.15

cellular parameter ...................................... 4.4.21

coating rate of impujses nn analytical line.............. 4.2.12

contrast of a X-ray diffractometer....................... 4.2.13

crystal-analyser ........................................ 4.3.8

crystal diffraction X-ray spectrometer .................. 4.1.6

crystal-monochromator ................................... 4.3.9

crystallite deformation ................................. 4.4.20

definition oi thickness material......................... 4.4.15

defection limit ......................................... 4.2.14

diffractometric control complex-KYD ..................... 4.3.12

diffuse scattering under small sized angles ............. 4.4.26

diffusion intensity with an object....................... 4.4.27

direct method of measurement of the absorption

factor .................................................. 4.4.7

displacement range of a X-ray tube ...................... 4.2.4

fixed spectrometric X-ray channel ....................... 4.3.2

general puprose diffractometer........................... 4.1.2

input window working area the detector .................. 4.2.11

intensity relation method of analytical lines............ 4.4.6

local phase analysis..................................... 4.4.16

Lower's method........................................... 4.4.13

main instrumental error ................................. 4.2.1

maximum diffraction peak................................. 4.4.22

measurement erroe of a rotation angle ................... 4.2.8

method of addition of a defined phase.................... 4.4.5

method of analysis by X-ray spectrometry ................ 4.4.4

method of an interior standart........................... 4.4.8

method of crystal rotation and vibration ................ 4.4.14

method of X-ray (diffraction) analysis .................. 4.4.3

minimum step of scanning ................................ 4.2.18

powder method............................................ 4.4.17

qualitative X-ray phase analysis ........................ 4.4.1

quanitative X-ray phase analysis ........................ 4.4.2

radiation sampling ...................................... 4.2.19

range of angular displacements .......................... 4.2.3

range of the analysed chemical elements ................. 4.2.16

regulation speed ........................................ 4.2.5

reference substance ..................................... 4.4.23

rotation range of a testing sample ...................... 4.2.10

scanning spectrometric X-ray channel .................... 4.3.3

small angle X-ray diffractometer ........................ 4.1.4

smearing of a diffraction peak .......................... 4.4.25

standart matter.......................................... 4.4.19

source of X-ray-radiation................................ 4.3.11

spectracal resolution ................................... 4.2.17

spectrometric X-ray channel ............................. 4.3.1

television type detector ................................ 4.3.7

testing method at different pressions ................... 4.4.12

testing method at different temperatures ................ 4.4.11

testing method of the surface and the fine films......... 4.4.10

test method with small angles ........................... 4.4.18

texture X-ray diffractometer ............................ 4.1.3

- 24 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

turning angle admissible deviation of the detection

block ................................................... 4.2.2

voltage definition ...................................... 4.4.9

weakening factor......................................... 4.4.24

working angle range of a metric adapter.................. 4.2.6

X-ray analytical complex ................................ 4.1.7

X-ray camera ............................................ 4.3.5

X-ray diffractometer .................................... 4.1.1

X-ray filter ............................................ 4.3.10

X-ray goniometry adapter................................. 4.3.4

X-ray radiation detector ................................ 4.3.6

X-ray spectrometer ...................................... 4.1.5

- 25 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

AБETKOBИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ TEPMІНІВ

adapteur gomiometrique [a4] rayons X ................... 4.3.4 \*

analyse de phase locale................................. 4.4.16

analyse de phases qualitative [a4] rayons X ............ 4.4.1 \*

analyse de phase quantative [a4] rayons X .............. 4.4.2 \*

an[e2]antissement d'une pointe de diffraction .......... 4.4.25 \*

angle d'extraction de la radiation X ................... 4.2.15 \*

cadence de comtage des impulsions sur ligne

analytique ............................................. 4.2.12

canal de balayage spectrometrique [a4] rayons X ........ 4.3.3 \*

canal spectrometrique [a4] rayons X .................... 4.3.1 \*

canal spectrometrique, fixe [a4] rayons X .............. 4.3.2 \*

chambre de diffraction ................................. 4.3.5

choix de radiation ..................................... 4.2.19

complexe analytique [a4] rayons X ...................... 4.1.7 \*

complexe de commande diffractom[e2]trique .............. 4.3.12 \*

contraste d'un diffractomnetre [a4] rayons X ........... 4.2.13 \*

cristal-analyseur ...................................... 4.3.8

cristal-mnnochromateur ................................. 4.3.9

d[e2]finition de l'[e2]paisseur d'un materiau ......... 4.4.15 \*

d[e2]finition de tensions .............................. 4.4.9 \*

d[e2]formation de la cristallite ....................... 4.4.20 \*

d[e2]tecteur de radiation X ............................ 4.3.6 \*

d[e2]tecteur de type-television ........................ 4.3.7 \*

deviation angulaire admissible du bloc de

d[e2]tection ........................................... 4.2.2 \*

diffractometre [a4] rayons X ........................... 4.1.1 \*

diffractometre [a4] rayons X [a4] petits angles ........ 4.1.4 \*

diffractometre de texture [a4] rayons X ................ 4.1.3 \*

diffractometre d'usage general ......................... 4.1.2

dispersion diffuse [a4] petite angles .................. 4.4.26 \*

erreur de mesurage d'un angle de rotation .............. 4.2.8

erreur d'un bloc angulaire ............................. 4.2.7

erreur principale due aux insrtumets ................... 4.2.1

facteur d'affaiblissement .............................. 4.4.24

liltre [a4] rayons X ................................... 4.3.10 \*

gamme de d[e2]placement d'un tube radiog[e2]n .......... 4.2.4 \*

gamme de rotation d'un [e2]chantillon [a4] [e2]tudier .. 4.2.10 \*

gamme des angles de travail d'un adapteur

m[e2]trique ............................................ 4.2.6 \*

gamme des d[e2]placements angulaires ................... 4.2.3 \*

gamme des elements chimiques analyser .................. 4.2.16

intensit[e2] de diffusion avec un objet ................ 4.4.27 \*

limite de d[e2]tection ................................. 4.2.14 \*

linge analytique ....................................... 4.4.28

mati[e2]re standard .................................... 4.4.19 \*

m[e2]thode d'addition d'une phase [a4] d[e2]finir ...... 4.4.5 \*

m[e2]thode d'analyse radiospectrale .................... 4.4.4 \*

m[e2]thode d'analyse (strycturale) aux rayons X ........ 4.4.3 \*

m[e2]thode de Lower .................................... 4.4.13 \*

m[e2]thode de mesurage direct du coefficient \*

d'absorption ........................................... 4.4.7

m[e2]thode de poudre ................................... 4.4.17 \*

m[e2]thode de rotation et de vibration du crystal ...... 4.4.14 \*

m[e2]thode des relations d'inteesite des lignes \*

analytiques ............................................ 4.4.6

m[e2]thode d'[e2]tude aux pressions diff[e2]rentes ..... 4.4.12 \*

- 26 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

m[e2]thode d'[e2]tude aux temperatures diff[e2]rentes .. 4.4.11 \*

m[e2]thode d'[e2]tude avee petite angles ............... 4.4.18 \*

m[e2]thode d'[e2]tude de la surface et des films fins .. 4.4.l0 \*

m[e2]thode d'un standard int[e2]rieur .................. 4.4.8 \*

param[e2]tre d'un cellule .............................. 4.4.21 \*

pas minimal de balayage ................................ 4.2.18

r[e2]solution angulaire ................................ 4.2.9 \*

r[e2]solution spectrale ................................ 4.2.17 \*

source de rayonnement .................................. 4.3.11

spectrom[e2]tre [a4] rayons X........................... 4.1.5 \*

spectrom[e2]tre de diffraction [a4] cristal [a4] \*

rayons X ............................................... 4.1.6

substance [e2]talon .................................... 4.4.23 \*

surface utile de la lucarne d'entr[e2]e du \*

d[e2]tecteur ........................................... 4.2.11 \*

valeur maximale du point difftraction .................. 4.4.22

vitesse de r[e2]glage .................................. 4.2.5 \*

- 27 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

анализ рентгеновский фазовый количественный ............. 4.4.2

анализ рентгеновский фазовый качественный ............... 4.4.1

анализ фазовый локальный ................................ 4.4.16

вещество стандартное .................................... 4.4.19

вещество эталонное ...................................... 4.4.23

выбор излучения ......................................... 4.2.19

детектор рентгеновского излучения ....................... 4.3.6

детектор телевизионного типа ............................ 4.3.7

деформация кристаллита .................................. 4.4.20

диапазон анализируемых химических элементов ............. 4.2.16

диапазон перемещения рентгеновской трубки................ 4.2.4

диапазон поворота исследуемого образца .................. 4.2.10

диапазон рабочих углов гониометрической приставки ....... 4.2.6

диапазон угловых перемещений ............................ 4.2.3

дифрактометр общего назначения........................... 4.1.2

дифрактометр рентгеновский .............................. 4.1.1

дифрактометр рентгеновский малоугловой................... 4.1.4

дифрактометр рентгеновский текстурный.................... 4.1.3

интенсивность рассеивания объектом ...................... 4.4.27

источник рентгеновского излучения ....................... 4.3.11

камера рентгеновская .................................... 4.3.5

канал рентгеновский спектрометрический .................. 4.3.1

канал рентгеновский спектрометрический сканирующий ...... 4.3.3

канал рентгеновский спектрометрический фиксированный .... 4.3.2

комплекс рентгеновский аналитический .................... 4.1.7

комплекс управляющий дифрактометрический ................ 4.3.12

контрастность рентгеновского дифрактометра .............. 4.2.13

коэффициент ослабления .................................. 4.4.24

кристалл-анализатор...................................... 4.3.8

кристалл-монохроматор ................................... 4.3.9

линия аналитическая ..................................... 4.4.28

максимум дифракционного пика ............................ 4.4.22

метод внутреннего стандарта ............................. 4.4.8

метод вращения и колебания кристалла .................... 4.4.14

метод добавления определяемой фазы ...................... 4.4.5

метод исследования поверхности и тонких пленок .......... 4.4.10

метод исследования при малых углах ...................... 4.4.18

метод исследования при различных давлениях............... 4.4.12

метод исследования при различных температурах ........... 4.4.11

метод Лауэ .............................................. 4.4.13

метод отношений итенсивности аналитических линий ........ 4.4.6

метод порошка ........................................... 4.4.17

метод прямого измерения коэффициента поглощения ......... 4.4.7

метод рентгеноспектрального анализа ..................... 4.4.4

метод рентгеноструктурного анализа ...................... 4.4.3

определение напряжений .................................. 4.4.9

определение толщины материала ........................... 4.4.15

отклонение угла поворота блока дефектирования

допустимое .............................................. 4.2.2

параметр ячейки ......................................... 4.4.21

площадь входного окна детектора рабочая.................. 4.2.11

погрешность аппаратурная основная ....................... 4.2.1

погрешность измерения угла поворота ..................... 4.2.8

погрешность углового устройства ......................... 4.2.7

предел обнаружения....................................... 4.2.14

приставка рентгеновская гониометрическая ................ 4.3.4

- 28 -

ДСТУ Б А.1.1-8-94

размытие дифракционного пика............................. 4.4.25

разрешение спектральное ................................. 4.2.17

разрешение угловое ...................................... 4.2.9

рассеивание под малыми углами диффузное ................. 4.4.26

скорость счета импульсов на аналитической линии.......... 4.2.12

скорость установочная ................................... 4.2.5

спектрометр рентгеновский ............................... 4.1.5

спектрометр рентгеновский кристалл-дифракционный ........ 4.1.6

угол отбора рентгеновского излучения..................... 4.2.15

фильтр рентгеновский .................................... 4.3.10

шаг сканирования минимальный ............................ 4.2.18

Ключові слова: аналітична лінія, визначення, кристал-аналізатор,

кристал-монохроматор, коефіцієнт послаблення, межа виявлення,

похибка, рентгенівський аналіз, рентген-камера, спектрометр,

термін, швидкість.

Примітка.

\*/ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають

значенням в таблиці відповідності символів

